

Lichtwellenleiter — Verbindungselemente und passive Bauteile
Grundlegende Prüf- und MessverfahrenTeil 3-17: Untersuchungen und Messungen —
Anschliffwinkel schräg polierter Stifte
(IEC 61300-3-17:1999) Deutsche Fassung EN 61300-3-17:1999**DIN****EN 61300-3-17**Diese Norm enthält die deutsche Übersetzung der Internationalen Norm **IEC 61300-3-17**

ICS 33.180.20

Fibre optic interconnecting devices and passive components
Basic test and measurement procedures
Part 3-17: Examinations and measurements
Endface angle of angle-polished ferrules
(IEC 61300-3-17:1999);
German version EN 61300-3-17:1999

Ersatz für
DIN EN 61300-3-17:1998-09
Siehe Beginn der Gültigkeit

Dispositifs d'interconnexion et composants passifs à fibres optiques
Méthodes fondamentales d'essais et de mesures
Partie 3-17: Examens et mesures
Angle de la face terminale des embouts polis angulairement
(CEI 61300-3-17:1999);
Version allemande EN 61300-3-17:1999

Die Europäische Norm EN 61300-3-17:1999 hat den Status einer Deutschen Norm.**Beginn der Gültigkeit**

Die EN 61300-3-17 wurde am 1999-10-01 angenommen.

Daneben darf DIN EN 61300-3-17:1998-09 noch bis 2002-10-01 angewendet werden.

Nationales Vorwort

Für die vorliegende Norm ist das nationale Arbeitsgremium UK 412.7 „LWL-Verbindungstechnik und passive optische Komponenten“ der Deutschen Elektrotechnischen Kommission im DIN und VDE (DKE) zuständig.

Norm-Inhalt war veröffentlicht als E DIN IEC 86B/1011/CD:1997-11.

Änderungen

Gegenüber DIN EN 61300-3-17:1998-09 wurden folgende Änderungen vorgenommen:

- a) Vollständige Überarbeitung.
- b) Aufnahme vier verschiedener Prüfverfahren.

Frühere Ausgaben

DIN EN 61300-3-17: 1998-09

Fortsetzung Seite 2
und 14 Seiten EN

Deutsche Elektrotechnische Kommission im DIN und VDE (DKE)

Nationaler Anhang NA
(informativ)

Zusammenhang mit Europäischen und Internationalen Normen

Für den Fall einer undatierten Verweisung im normativen Text (Verweisung auf eine Norm ohne Angabe des Ausgabedatums und ohne Hinweis auf eine Abschnittsnummer, eine Tabelle, ein Bild usw.) bezieht sich die Verweisung auf die jeweils neueste gültige Ausgabe der in Bezug genommenen Norm.

Für den Fall einer datierten Verweisung im normativen Text bezieht sich die Verweisung immer auf die in Bezug genommene Ausgabe der Norm.

Der Zusammenhang der zitierten Normen mit den entsprechenden Deutschen Normen ist nachstehend wiedergegeben. Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Norm waren die angegebenen Ausgaben gültig.

IEC hat 1997 die Benummerung der IEC-Publikationen geändert. Zu den bisher verwendeten Normnummern wird jeweils 60000 addiert. So ist zum Beispiel aus IEC 68 nun IEC 60068 geworden.

Tabelle NA 1

Europäische Norm	Internationale Norm	Deutsche Norm	Klassifikation im VDE-Vorschriftenwerk
–	ISO 2538:1998	–	–

Deutsche Fassung

**Lichtwellenleiter – Verbindungselemente und passive Bauteile –
Grundlegende Prüf- und Messverfahren –
Teil 3-17: Untersuchungen und Messungen –
Anschliffwinkel schräg polierter Stifte
(IEC 61300-3-17:1999)**

Fibre optic interconnecting devices
and passive components - Basic test
and measurement procedures
Part 3-17: Examinations and
measurements – Endface angle of
angle-polished ferrules
(IEC 61300-3-17:1999)

Dispositifs d'interconnexion et
composants passifs à fibres optiques
Méthodes fondamentales d'essais et
de mesures
Partie 3-17: Examens et mesures
Angle de la face terminale des
embouts polis angulairement
(CEI 61300-3-17:1999)

Diese Europäische Norm wurde von CENELEC am 1999-10-01 angenommen. Die CENELEC-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschäftsordnung zu erfüllen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen dieser Europäischen Norm ohne jede Änderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist.

Auf dem letzten Stand befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim Zentralsekretariat oder bei jedem CENELEC-Mitglied auf Anfrage erhältlich.

Diese Europäische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Französisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache, die von einem CENELEC-Mitglied in eigener Verantwortung durch Übersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Zentralsekretariat mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CENELEC-Mitglieder sind die nationalen elektrotechnischen Komitees von Belgien, Dänemark, Deutschland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Österreich, Portugal, Schweden, Schweiz, Spanien, Tschechische Republik und dem Vereinigten Königreich.

CENELEC

Europäisches Komitee für Elektrotechnische Normung
European Committee for Electrotechnical Standardization
Comité Européen de Normalisation Electrotechnique

Zentralsekretariat: rue de Stassart 35, B – 1050 Brüssel

Vorwort

Der Text des Schriftstücks 86b/1225/FDIS, zukünftige 2. Asugabe von IEC 613000-3-17, ausgearbeitet von dem SC 86B „Fibre optic interconnecting devices and passive components“ des IEC TC 86 „Fibre optics“, wurde der IEC-CENELEC Parallelen Abstimmung unterworfen und von CENELC am 1999-10-01 als EN 61300-3-17 angenommen.

Nachstehende Daten wurden festgelegt:

- spätestes Datum, zu dem die EN auf nationaler Ebene durch Veröffentlichung einer identischen nationalen Norm oder durch Anerkennung übernommen werden muss (dop): 2000-07-01
- spätestes Datum, zu dem nationale Normen, die der EN entgegenstehen, zurückgezogen werden müssen (dow): 2002-10-01

Anerkennungsnotiz

Der Text der Internationalen Norm IEC 61300-3-17:1999 wurde von CENELEC ohne irgendeine Abänderung als Europäische Norm angenommen.

Inhalt

	Seite
Vorwort	2
1 Allgemeines	4
1.1 Anwendungsbereich und Zweck	4
1.2 Normative Verweisungen	4
2 Allgemeine Beschreibung	4
2.1 Verfahren 1 – Automatisches Interferometerverfahren.....	4
2.2 Verfahren 2 – Manuelles Interferometerverfahren	6
2.3 Verfahren 3 – Mechanisches Profilometerverfahren	6
2.4 Verfahren 4 – Lichtreflexionsverfahren.....	6
3 Prüfaufbau	7
3.1 Verfahren 1 – Automatisches Interferometerverfahren.....	7
3.2 Verfahren 2 – Manuelles Interferometerverfahren	8
3.3 Verfahren 3 – Mechanisches Profilometerverfahren	8
3.4 Verfahren 4 – Lichtreflexionsverfahren	9
4 Durchführung	10
4.1 Verfahren 1 – Automatisches Interferometerverfahren.....	10
4.2 Verfahren 2 – Manuelles Interferometerverfahren	10
4.3 Verfahren 3 – Mechanisches Profilometerverfahren	11
4.4 Verfahren 4 – Lichtreflexionsverfahren.....	13
5 Festzulegende Einzelheiten	13
5.1 Verfahren 1 – Automatisches Interferometerverfahren.....	13
5.2 Verfahren 2 – Manuelles Interferometerverfahren	14
5.3 Verfahren 3 – Mechanisches Profilometerverfahren	14
5.4 Verfahren 4 – Lichtreflexionsverfahren	14